

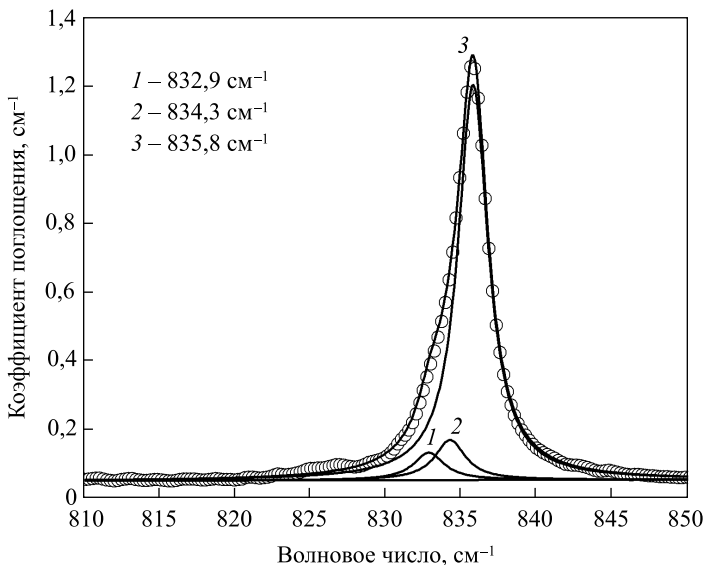


Рис. 2. Фрагмент спектра поглощения, измеренного при низкой температуре, для образца Cz-Si ($[\text{O}_i] = 8,3 \cdot 10^{17}$, $[\text{C}_s] = 7 \cdot 10^{16}$, $[\text{P}] = 1 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$), облученного нейтронами ($F = 7,5 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-2}$), после отжига при температуре 100 °C в течение 30 мин. Сплошные линии – подгонка с использованием функции Лоренца после коррекции базовой линии

Fig. 2. Fragment of the absorption spectrum measured at low temperature for a Cz-Si sample ($[\text{O}_i] = 8.3 \cdot 10^{17}$, $[\text{C}_s] = 7 \cdot 10^{16}$, $[\text{P}] = 1 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$) irradiated with neutrons ($F = 7.5 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-2}$) after annealing at a temperature 100 °C for 30 min. Solid lines – Lorentz fit after baseline correction